

unleash the
power

バウンダリスキャンテスト
の新世代
of **XJTAG**



設計・開発から出荷検査、メンテナンスまで一貫してコスト削減

XJTAG バウンダリスキャンによるボードテストは、

- ・ 設計/プロトタイプ の 開発/デバッグをスピードアップ
- ・ 製造/品質管理/保守など全工程でテストを再利用
- ・ JTAG未対応デバイスにも簡単に対応

XJTAG バウンダリスキャンテストツールにより、設計・開発から製造・メンテナンスまでボードのテストを共有することができるようになります。 JTAG未対応デバイスを含めての接続テストは、C言語ライクな記述でデバイスごとに提供される再利用可能なテストを利用して簡単に作成が出来ます。イーサネットのループバック試験など更なるテストも容易に生成。更に、CPLD/FPGA/Flashプログラミングもサポート。ボードテストの新時代の幕開けです。





TTPCom 社 成功事例

2G/3G携帯電話のリファレンスボードの設計・開発を請負うTTPCom社では、複数のFPGA、ARM9マイクロプロセッサ、DSPなどを含むボードのデバッグ、テストにXJTAGツールを採用。全デバイスピンの状態をリアルタイムに表示し、迅速に欠陥を抽出。複雑で高機能なボードの開発期間を劇的に短縮(数日~数週間)できるようになりました。また、開発で使用したテストスクリプトは製造会社における出荷テストに再利用されています。



Barric 社 成功事例

プロトタイプボード、製品の製造・リペアを手掛けるBarric社では、BGAなどの表面実装が増えるに従い、従来のテスト手法の制約に直面しました。テストカバレッジを向上させ、故障診断をスピードアップする為に複数の製品からXJTAGを採用した理由は、低価格、使いやすさによる開発効率向上でした。加えてテストスクリプトがデバイス依存であり多数の異なるプロジェクト間で再利用することができ、生産性を飛躍的に向上することができました。ボードのテストは数分単位になり(数時間から)、より厄介な欠陥も削減できるようになりました。

XJAnalyser : ボードのデバッグ

JTAGチェーンの表示・デバッグ(ロジックアナライザ & 信号発生器)。リアルタイムに各信号の状態を観測。全信号網から特定ピンの問題を容易に抽出。BSDLファイルによる設定だけ。STAPL/JAM, SVF もサポート。

XJEase : デバイス間接続テスト、デバイスプログラミング

JTAG未対応デバイスを含めての接続テスト。デバイスごとに提供されるボードに依存しない再利用可能なテスト。C言語的記述によりイーサネットのループバック試験など更なるテストも容易に生成。また、CPLD/FPGA/ Flash プログラミングもサポート。

XJRunner : テスト実行(製造、メンテナンス、フィールドテスト)

XJEase で生成されたテストを実行し、パス/フェイルの判定。ボードごとのS/NやMACアドレスなどを登録し管理することも可能。

XJIO : 外部 I/O テスト環境

208デジタル/16アナログ信号。XJIOを複数連結して拡張可能。

XJLink : USB 2.0対応 Jtag プローブ 外部電源不要/小型軽量

